

3次元電子顕微鏡の研究開発

I 試験研究の全体計画

1. 研究の趣旨

現在、我々の周りには環境、エネルギー関連などの諸問題が増大している。一方、真に豊かな生活への要求も強く、これらを実現する社会の構築が強く求められている。この対応のためには科学・技術、なかんずく、高機能材料、先端デバイス等の開発への関心が高まっている。これを実現するためには、本質に迫ることを可能とする先端的計測ツールの知的基盤整備を行うことが、必要となっている。

材料、デバイス等の高性能化、あるいは新しい高機能材料、新デバイスの創出は、原子レベルの微細構造を制御することによって達成される。例えば、耐熱高強度セラミックスや半導体レーザーなどでは、結晶中の欠陥や不純物などの空間分布、元素の結合状態や種類によって特性が決定される。それらの機能、特性などを含めた微細構造評価、新現象の発見には、原子レベルでの3次元観察と高精度な結合状態や元素の分析が必要不可欠である。

このように微細構造の計測技術は、重要であるにもかかわらず、従来の計測技術では内部構造の2次元的な観察しかできないことや、ナノメータ領域の元素結合状態を高精度で測定できないなどの問題があり、新しい装置の実現が必要とされている。

本開発は、このような状況に鑑み、次世代材料、デバイス等の研究において、飛躍的進歩（ブレイク・スルー）を可能とする固体内部構造をサブナノメータオーダーの分解能で立体観察するとともに、元素の種類と結合状態を分析でき、さらに、科学・技術の広い範囲に波及効果を及ぼす研究支援ツールである「3次元電子顕微鏡」を開発、提供することにある。そのために、以下の研究開発を行う。

まず、第I期において、要素技術の開発と、その評価を行うテストベンチとして、3次元電子顕微鏡の試作機の開発を行う。そのために、①3次元電子顕微鏡の装置構成技術に関する研究およびシステムの開発、②3次元電子顕微鏡の画像処理技術に関する研究、③3次元電子顕微鏡による材料、デバイス構造評価に関する研究、④3次元電子顕微鏡の評価技術および標準試料作製技術に関する研究、を行う。次に第II期では、これら第I期の評価結果に基づき、さらなる高機能化、適応性向上を図り、所期の目標性能を発揮する3次元電子顕微鏡を開発する。

2. 研究概要

研究の飛躍的進歩を可能にし、また、波及効果の大きい

先端的3次元観察・分析装置を目指して、固体内部構造を0.5 nm以下の空間分解能で立体観察するとともに、元素の結合状態と元素の種類をエネルギー分解能0.5 eV以下で分析する3次元電子顕微鏡を開発する。そのために、以下の研究開発を行う。

1. 3次元電子顕微鏡の装置構成技術に関する研究およびシステムの開発

高空間分解能の3次元像観察と高エネルギー分解能の結合状態・元素分析に資するため、試料微動系、超高真空系、電子線照射・検出系、電子エネルギー分析系等の装置構成技術を研究するとともにシステムの開発を行う。

(1) 試料微動系・超高真空系に関する研究およびシステムの開発（理化学研究所）

3次元電子顕微鏡を構成するにあたり、それに必要となる多軸微動ステージ、昇温脱離による超高真空技術および3次元電子顕微鏡本体システムの開発を行う。

(2) 電子線照射・検出系に関する研究（㈱日立製作所）

高輝度な電子線をサブナノメータ径に収束する電子レンズと高感度、高解像度電子検出系により、試料への電子線入射条件制御と、試料内で散乱された電子の高S/N検出を行う電子線照射・検出系に関する研究を行う。

(3) 電子エネルギー分析系に関する研究（㈱日立製作所）

高精度な結合状態、元素分析に資するため、低収差化電子光学系と高安定化電気回路により、試料を透過した電子のエネルギーを高分解能で測定する電子エネルギー分析系に関する研究を行う。

2. 3次元電子顕微鏡の画像処理技術に関する研究

高精度、高速な3次元データの取得と電子顕微鏡操作のユーザフレンドリー化に資するため、高精度・高速CT画像処理と観察操作自動化用画像処理等の画像処理技術の研究する。

(1) 高精度・高速CT画像処理に関する研究（理化学研究所）

対象の高精度で詳細な3次元データの取得に資するため、試料を傾斜しながら観察した複数の電子顕微鏡像から、内部構造を含めた立体微細構造を再構築する、高速・高精度3次元CT（デジタル断層および輪郭）画像処理手法に関する研究を行う。

(2) 観察操作自動化用画像処理に関する研究（工学院大学）

従来のパワースペクトル画像計測手法に代わって、位相スペクトル計測手法を採用し、これによる電子光学パラメータ自動調整の実用化アルゴリズムを作成し、実効的な自動化用画像処理手法を確立する。

3. 3次元電子顕微鏡による材料、デバイス構造評価に関する研究

開発した3次元電子顕微鏡の高度な活用に資するため、電子顕微鏡像の観察法とデータ解析法、エネルギー分析データの測定法とデータ解析法を研究する。

(1) 電子顕微鏡像の観察法とデータ解析法に関する研究 (名古屋大学)

3次元電子顕微鏡の活用の高度化に資するため、電子顕微鏡像の暗視野高分解能観察条件の決定およびナノ材料の構造解析法の研究を行う。

(2) エネルギー分析データの測定法とデータ解析法に関する研究 (日本原子力研究所)

る研究 (日本原子力研究所)

半導体デバイス材料の電子エネルギー損失スペクトル実験を行い、半導体材料に固有のスペクトル特性を把握・解析し、デバイス構造の化学的情報を抽出するデータ解析法について検討する。

4. 3次元電子顕微鏡の評価技術および標準試料作製技術に関する研究 (理化学研究所)

3次元電子顕微鏡の性能を正しく評価するために、ナノスケールの立体構造をもった半導体の標準試料を数種類開発し、それら試料のサイズ、組成、歪み等の物性をあらかじめ明らかにしておく。

3. 年次計画

研究項目	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度
1. 3次元電子顕微鏡の装置構成技術に関する研究およびシステムの開発					
(1) 試料微動系・超高真空系に関する研究及びシステムの開発	Design Review	第Ⅰ期装置設計・製作		第Ⅱ期装置設計・製作	取りまとめ
(2) 電子線照射・検出系に関する研究			調整・評価		調整・評価
(3) 電子エネルギー分析系に関する研究	要素技術開発		評価及び高度化検討	要素技術及びシステムの高度化	取りまとめ
2. 3次元電子顕微鏡の画像処理技術に関する研究					
(1) 高精度・高速CT画像処理に関する研究	アルゴリズム検討	CT画像処理法の開発		CT画像処理法の高速・高精度化	取りまとめ
(2) 観察操作自動化用画像処理に関する研究	アルゴリズム検討	自動化用画像処理法の開発		自動化用画像処理法の高機能化	取りまとめ
3. 材料、デバイス構造評価に関する研究					
(1) 電子顕微鏡像の観察法とデータ解析法に関する研究	理論検討	像観察、データ解析法の開発		像観察、データ解析法の高度化	取りまとめ
(2) エネルギー分析データの測定法とデータ解析法に関する研究	理論検討	スペクトル測定、データ解析法の開発		スペクトル測定、データ解析法の高度化	取りまとめ
4. 3次元電子顕微鏡の評価技術および標準試料作製技術に関する研究					
		仕様検討	第Ⅰ期用評価法・標準試料開発	第Ⅱ期用評価法・標準試料開発	取りまとめ
5. 研究運営					
所要経費(合計)	229百万円	239百万円			

II 平成10年度における実施体制

研究項目	担当機関	研究担当者
1. 3次元電子顕微鏡の装置構成技術に関する研究およびシステムの開発 (1) 試料微動系・超高真空系に関する研究およびシステムの開発 (2) 電子線照射・検出系に関する研究 (3) 電子エネルギー分析系に関する研究	理化学研究所研究基盤技術部表面解析室 理化学研究所研究基盤技術部極限計測技術室 理化学研究所研究基盤技術部極限環境技術室 理化学研究所研究基盤技術部素形材工学研究室 (株)日立製作所中央研究所先端技術研究部 (株)日立製作所計測器事業部科学機器第一設計部	岩木正哉 新野俊樹 渡部秀 山形豊 柿林博司 砂子沢成人
2. 3次元電子顕微鏡の画像処理技術に関する研究 (1) 高精度・高速CT画像処理に関する研究 (2) 観察操作自動化用画像処理に関する研究	理化学研究所研究基盤技術部極限環境技術室 工学院大学電気工学科電子顕微鏡研究室	加瀬究 馬場則男
3. 材料, デバイス構造評価に関する研究 (1) 電子顕微鏡像の観察法とデータ解析法に関する研究 (2) エネルギー分析データの測定法とデータ解析法に関する研究	名古屋大学工学部応用物理学教室 日本原子力研究所東海研究所材料研究部固体物理研究室	田中信夫 倉田博基
4. 評価技術および標準試料作製技術に関する研究	理化学研究所半導体工学研究室	青柳克信
5. 研究運営	理化学研究所研究基盤技術部表面解析室	岩木正哉

III 運営委員会

委員	所属
○岩木正哉	理化学研究所 研究基盤技術部表面解析室長
青柳克信	理化学研究所 半導体工学研究室主任研究員
柿林博司	(株)日立製作所 中央研究所先端技術研究部主任研究員
倉田博基	日本原子力研究所 東海研究所材料研究部固体物理研究室副主任研究員
砂子沢成人	(株)日立製作所 計測器事業部科学機器第一設計部主任技師
田中信夫	名古屋大学 工学部応用物理学教室助教授
馬場則男	工学院大学 電気工学科電子顕微鏡研究室教授

(注：○は運営委員長)